

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut • Merianstraße 28 • D-63069 Offenbach

STMicroelectronics
190, Avenue Celestine Coq
Z.I. 13106 Rousset CEDEX
FRANCE

Offenbach, 2010-05-18

Your ref.
Vincent ONDE

Your letter
2010-05-18

Our ref. - please indicate
5012186-4970-0001/131612
FG23/Swa

Contact
Mr. Schwab
Tel (+49) (69) 83 06-607
Fax (+49) (69) 83 06-606
ralf.schwab@vde.com

Dear Sirs,

Translation: In any case the German version shall prevail

P r ü f b e r i c h t zur Information des Auftraggebers **Test Report for the Information of the applicant**

Produkt / Product Component for washing machines and dishwashers
Typ / Type Microcontr.for Home Appl. Autom.Controls

Dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Teilen von Normen festzustellen.

This test report contains the result of a single investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the accordance with the thereafter listed standards resp. parts of standards.

Der Prüfbericht berechtigt nicht zur Benutzung eines Prüfzeichens des VDE und des Zeichens "GS=geprüfte Sicherheit" und erstreckt sich nicht auf alle für das geprüfte Erzeugnis geltenden VDE-Bestimmungen.

The test report does not entitle to use a VDE Certification mark and the „GS = geprüfte Sicherheit (tested safety)“ and does not refer to all VDE specifications applicable for the tested product.

Dieser Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut einschließlich dieser Vorbemerkung und unter Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden.

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Testing and Certification Institute
Institut d'Essais et de Certification
Merianstraße 28
D-63069 Offenbach
<http://www.vde.com>

Telefon
+49 (0) 69 83 06-0
Telefax
+49 (0) 69 83 06-555
e-mail
vde-institut@vde.com

Notified Body according to the Equipment and Product Safety Act (GPSG) for technical work equipment and consumer products.
Notified Body according to the EMC directive for the electromagnetic compatibility (EMC) of appliances.
Accredited by DAR accreditation bodies according to DIN EN ISO/IEC 17025, DIN EN 45011 and 45012.
Accredited by: IEC – International Electrotechnical Commission – IEC/IEC/CB, IECQ and CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization – CCA, HAR, ENEC.

This test report may only be passed to a third party in its complete wording including this preamble and the date of issue.

Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts.

Any publication or reproduction requires the prior written approval of the VDE Testing and Certification Institute.


I Beschreibung **Description**

I Beschreibung <i>Description</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Software Selbstdiagnose-Bibliothek für die STM32-Mikrocontroller-Familie. • <i>SW selftest library for the STM32 microcontroller family.</i>
II Standards	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 60335-1:2001 (4.2 Edition) (incl. Corrigendum 1:2002) + A1:2004 + A2:2006 (incl. Corrigendum 1:2006) Annex R Table 11.12.7 and/or • EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 Annex R Table 11.12.7. • EN 60730-1: 2009 Annex H Table 11.12.7 • IEC 60730 Ed. 3.2: 2007-03 Annex H Table 11.12.7
III Hersteller <i>Manufacturer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • STMicroelectronics • 2083 La Gazelle Ariana, Tunis, TUNISIA
IV Identifikation <i>Identification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Version 2.0 for 32 Bit devices • Intended for usage with the following types: • STM32F100VBT6 • STM32F103VBT6 • STM32F103ZDT6
V Selbstdiagnose Funktionen Selftest functions Startup Library	<ul style="list-style-type: none"> • Register test (read/write compare) • CRC test (16Bit CRC) • Control flow for initial tests (counter method) • RAM test (March C- / March X) • Clock test (comparison / 2 clocks) • WD selftest (source of last reset)
VI Selbstdiagnose Funktionen Selftest functions Runtime Library	<ul style="list-style-type: none"> • Register test (read/write compare) • Stack test (special pattern) • Clock test (comparison / 2 clocks) • CRC tests (CRC 16 Bit / blockwise) • WD control (used for errors) • Sliced RAM test (March C- / March X) • Control flow (counter method)

VII Bemerkungen <i>Remarks</i>	<ul style="list-style-type: none"> • RAM Bereich ist nicht linear aufgebaut, Zugriff seitens der Testroutinen nur mit den gelieferten „scrambling/descrambling“ Routinen. • Scrambled RAM needs scrambling and descrambling methods (included in package)
VIII Benutzung <i>Usage</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Module sind zur Einbindung in eine übergeordnetes Selbstdiagnoseprogramm vorgesehen, welches vom Hersteller der Steuerung zur Prüfung vorzulegen ist. • <i>The modules are intended to be included in a supervisory self diagnostic program which has to be presented for approval by the manufacturer of the electronic control.</i>
VIII Ergebnis <i>Result</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Die geprüften Module erfüllen die Anforderungen gemäß der unter II genannten Prüfbestimmungen. • Die Einbindung der Module ist in der jeweiligen Applikation zu prüfen. • <i>The tested modules fulfil the requirements according the test specifications referred in chapter II.</i> • <i>The implementation of the modules has to be tested in each application.</i>
X Fehlerabdeckung Diagnostic coverage	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fehlerabdeckung entspricht den Anforderungen nach Tabelle H 11.12.7 • The diagnostic coverage fulfils the requirements of Table H 11.12.7

Mit freundlichen Grüßen
With best regards

Abteilung FG23
Dept. FG23

i.A. 

Ingo Schälter



Christoph Türk

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

